

标准详细信息	
标准状态	现 行
标准编号	T/CECA 99—2024
中文标题	汽车用石英晶体元件可靠性试验
英文标题	Reliability test of quartz crystal units for automobiles
国际标准分类号	ICS 31.140
中国标准分类号	CCS L 21
发布日期	2024 - 7 - 23
实施日期	2024 - 8 - 01
起草单位	广东惠伦晶体科技股份有限公司、浙江汇隆晶片技术有限公司、泰晶科技股份有限公司、安徽晶赛科技股份有限公司、珠海东精大电子科技有限公司、南京中电熊猫晶体科技有限公司、武汉海创电子股份有限公司、深圳市晶峰晶体科技有限公司、河北远东通信系统工程有限公司、金华市创捷电子有限公司、唐山国芯晶源电子有限公司、成都晶宝时频技术股份有限公司、日照旭日电子有限公司、三生电子（天津）有限公司、江苏浩都频率科技有限公司、东晶电子金华有限公司、台晶（宁波）电子有限公司、鸿星科技（集团）股份有限公司、宁波晶创科技有限公司、华为技术有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、烟台明德亨电子科技有限公司、成都世源晶电科技有限公司、绍兴奥美电子科技有限公司、北京晨晶电子有限公司
起草人	赵积清、邢越、黄虎、刘峰、叶国萍、许哲隆、孟田、孙晓明、詹超、陈维彦、胡孔亮、谢尚平、孙川、高志祥、李坡、毛晶、熊卉芳、高青、刘其胜、张建伟、王盼、陈康、胡勍波、徐建民、李永斌、刘青彦，黄建友、刘思军、张传哲、王秋贞、祝希坚、尚虎、耿健、王晓东、李凯、沈俊男、徐俊俊、余剑、吴中林、班建珍、张国庆、卢艳东、黄琳、陈光星、黄屹、欧阳林、田培洪、夏春城、陈涵瀚、邓国华、魏金鑫、张健
主要技术内容	本文件确立了汽车用石英晶体元件的可靠性试验程序，并规定了可靠性试验方法。 本文件适用于汽车用石英晶体元件的可靠性试验，包含表面贴装（Surface Mounted Devices，SMD）晶体元件和插件式晶体元件、线状引出端（Through Hole Device，THD）晶体元件。
是否包含专利信息	否
标准文本	不公开